

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej :: STUDIA II STOPNIA ::

rok akademicki 2025/26

Promotor:	dr hab. inż. Serhii Semenov, prof. UKEN
Temat pracy magisterskiej (j. polski, j.angielski):	Integracja Sztucznej Inteligencji i cyberbezpieczeństwa w Systemach Zarządzania Relacjami z Klientami i Treścią w Branży Nieruchomości <i>Integration of Artificial Intelligence and Cybersecurity in Customer Relationship and Content Management Systems in the Real Estate Industry</i>
Zakres pracy i oczekiwane rezultaty praktyczne:	1 Analiza obecnie stosowanych systemów CRM i CMS. 2 Ocena potrzeb biznesowych związanych z obsługą klienta, marketingiem, zarządzaniem ofertami i automatyzacją procesów. 3 Projekt architektury integrującej moduły SI (np. rekomendacje, scoring leadów, klasyfikacja treści, chatboty) z mechanizmami cyberbezpieczeństwa (kontrola dostępu, szyfrowanie, audyt). 4 Testy funkcjonalne i bezpieczeństwa z wykorzystaniem rzeczywistych scenariuszy branżowych (np. tworzenie ogłoszeń, zapytania klientów, publikacja treści). 5 Opracowanie zaleceń wdrożeniowych dla firm z sektora nieruchomości.
Aspekt naukowy, problemowy, innowacyjny pracy:	Praca porusza problem ochrony danych i automatyzacji procesów biznesowych w dynamicznie rozwijającej się branży nieruchomości. Aspekt innowacyjny obejmuje: – zastosowanie modeli SI do inteligentnej analizy treści i obsługi klienta, – integrację SI z warstwą cyberbezpieczeństwa w systemach CRM/CMS, – analizę ryzyk związanych z generatywną SI (np. halucynacje modelu, wrażliwość na dane osobowe), – opracowanie hybrydowej architektury zwiększającej zarówno efektywność marketingową, jak i poziom bezpieczeństwa danych (RODO/GDPR — Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych / General Data Protection Regulation).
*Oprogramowanie, język programowania, środowisko systemowe:	
*Środowisko uruchomieniowe	
Dodatkowe wymagania i uwagi:	– Konieczne uwzględnienie dobrych praktyk RODO/GDPR. – Mile widziana implementacja mechanizmów wykrywania anomalii lub nadużyć użytkowników. – Wskazane porównanie skuteczności co najmniej dwóch modeli SI.
*Literatura:	

*pola opcjonalne